

Автоматизированный анализ кластеров и диспергированных систем

Аналитический комплекс **SIAMS-CP Nanotech** предлагает группу решений **SIAMS-CP Nanodispersion**™ для автоматизированного анализа изображений диспергированных систем и определения степени пространственной однородности распределения материала (дисперсности).

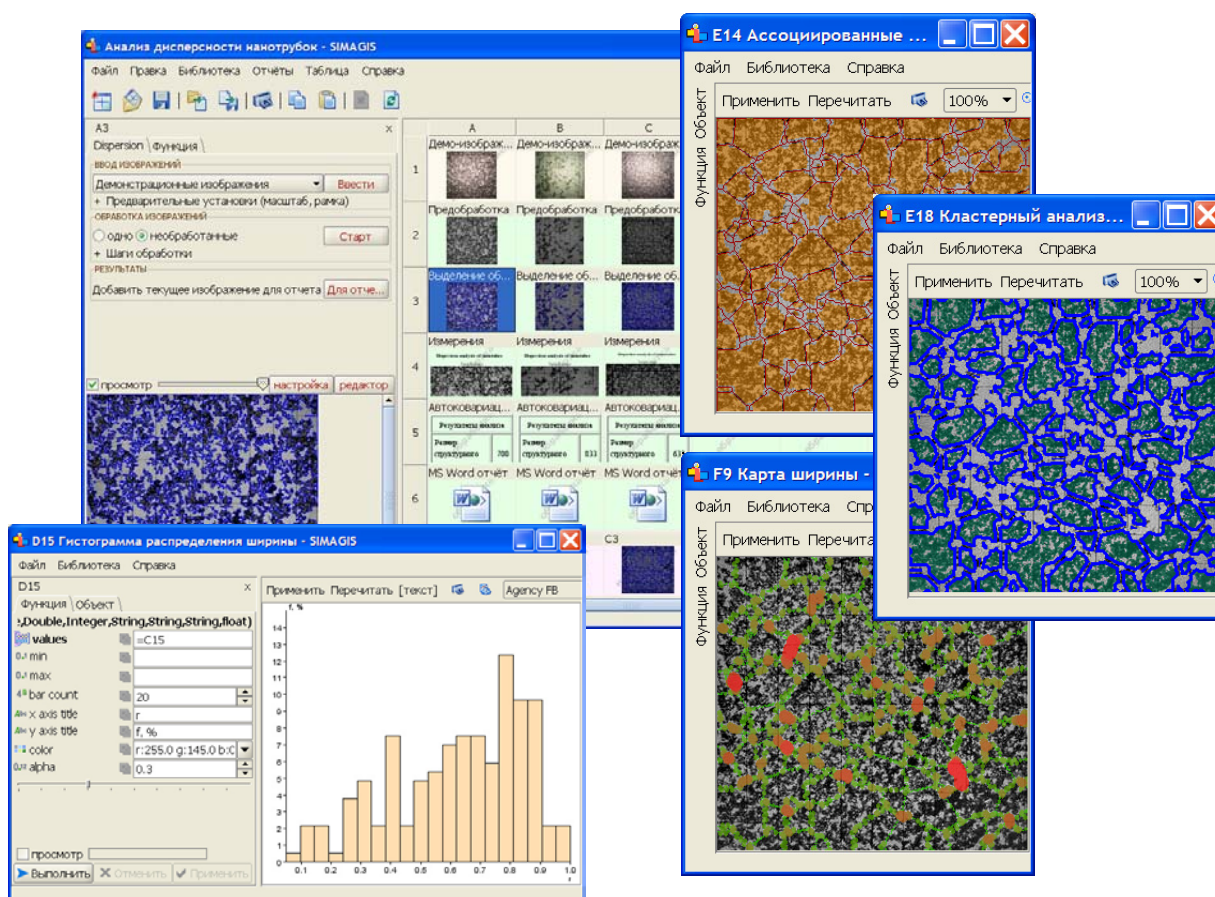
SIAMS-CP Nanodispersion™ представляет собой инструмент, позволяющий решать задачу оценки степени дисперсности наноструктур (нанотрубок, наночастиц) с помощью широкого набора стандартных и оригинальных подходов и характеристик, позволяющих количественно описывать свойства пространственного распределения наноструктур.

В результате работы решений автоматически создается отчет об измерениях в формате MS Word®, который включает в себя статистические характеристики результатов измерений параметров наноструктуры, представленные в табличном и графическом представлении. Кроме отчета со статистическими данными, пользователь имеет возможность экспортировать все результаты измерений каждого объекта в MS Excel®.

В группу **SIAMS-CP Nanodispersion**™ входят следующие решения:

Анализ степени дисперсности нанотрубок (ОМ, ПЭМ)

Решение предназначено для количественного описания степени диспергированности нанотрубок по их микроскопическим изображениям, представляющим собой изображения распределенных в пространстве наноструктур с различной степенью кластеризации. Для анализа дисперсности нанобъектов используются подходы кластерного и ковариационного анализа наряду со специфическими алгоритмами для определения морфологических и топологических параметров структуры в целом.



Компания СИАМС обеспечивает полную поддержку клиентов по установке, настройке комплекса решений **SIAMS-CP Nanotech**™, а также производит обучение работе с решениями.

За более подробной информацией обращайтесь:
Компания SIAMS
Тел / Факс: (343) 379-00-34 (35)
E-mail: info@siams.com Web: siams.com